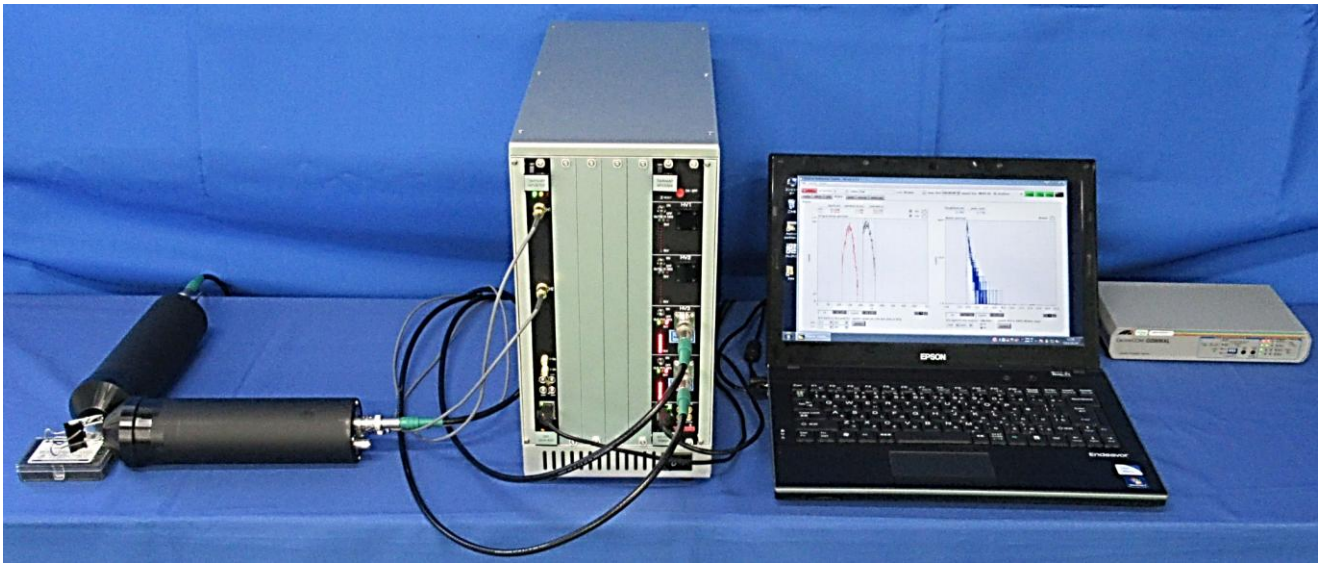
陽電子消滅寿命測定装置

TechnoAP

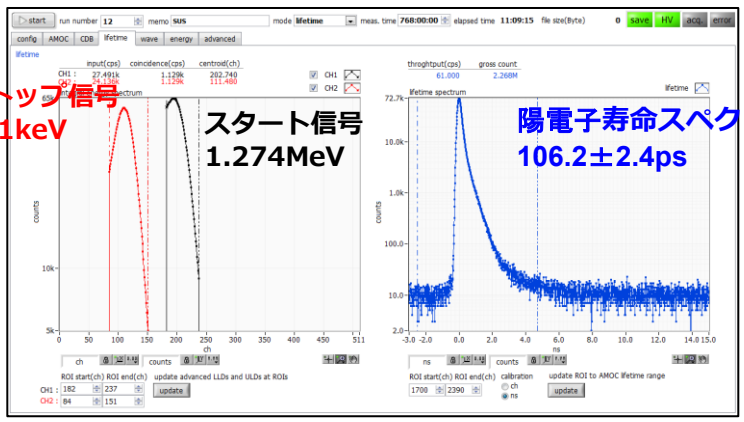
DPALMS-LD / DPALMS-L

分子レベルのナノスケール空間構造を解析できる陽電子消滅法の測定に必要な計測・電源機器が一つになりました。寿命測定(Lifetime)では2台のBaF_2シンチレータからの高速パルス信号を3GspsのADCで取り込み、デジタル信号処理によって寿命時間を算出し、寿命スペクトルを生成します。

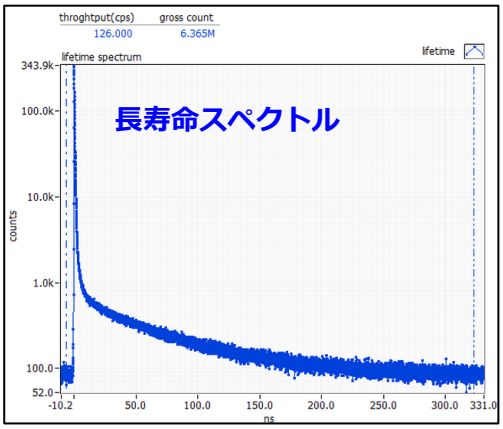
設置例 DPALMS-LD　　※DPALMS-Lは検出器を含まず。どちらもPCとハブは含まず。



Lifetime



線源：^{22}Na　試料：標準物質ステンレス鋼



線源：^{22}Na　試料：Yゼオライト

機能	陽電子/オルトポジトロニウム寿命測定
ADC	2CH 3Gsps 8bit
時間分解能	FWHM <190ps　※検出器による
測定時間レンジ	<80ns（最小Time/ch 10.2ps時）、<1100ns（最大Time/ch 166ps時）
寿命測定	標準物質ステンレス鋼　106.2±2.4 ps　陽電子寿命 標準物質ポリカーボネート　2.10±0.05 ns　オルトポジトロニウム寿命
高圧電源	2CH、最大-4000V(最大1mA) / CH（光電子増倍管用）
通信	イーサネット, TCP/IP
寸法・重量	170(W)x320(H)x400(D) mm, 約7550g
アプリケーション	データ計測制御用ソフトウェア

株式会社テクノエーピー
〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15
TEL:029-350-8011　FAX:029-352-9013
info@techno-ap.com

※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。
https://www.techno-ap.com

20260820